



САТОК – система тестирования самосинхронных микросхем

*В.С. Петрухин, Ю.А. Степченков,
Н.В. Морозов, Д.Ю. Степченков*

- **Адрес :** Институт проблем информатики РАН,
ул. Вавилова, д. 44, корпус 2, 119333,
Москва, Россия
- **Телефон:** 7 (495) 678-23-87
- **Fax:** 7 (495) 930 45 05
- **E-mail :** VPetruchin@ipiran.ru



Причины разработки

- Специфика функционирования самосинхронных схем
- Характер взаимодействия самосинхронных схем с внешней средой

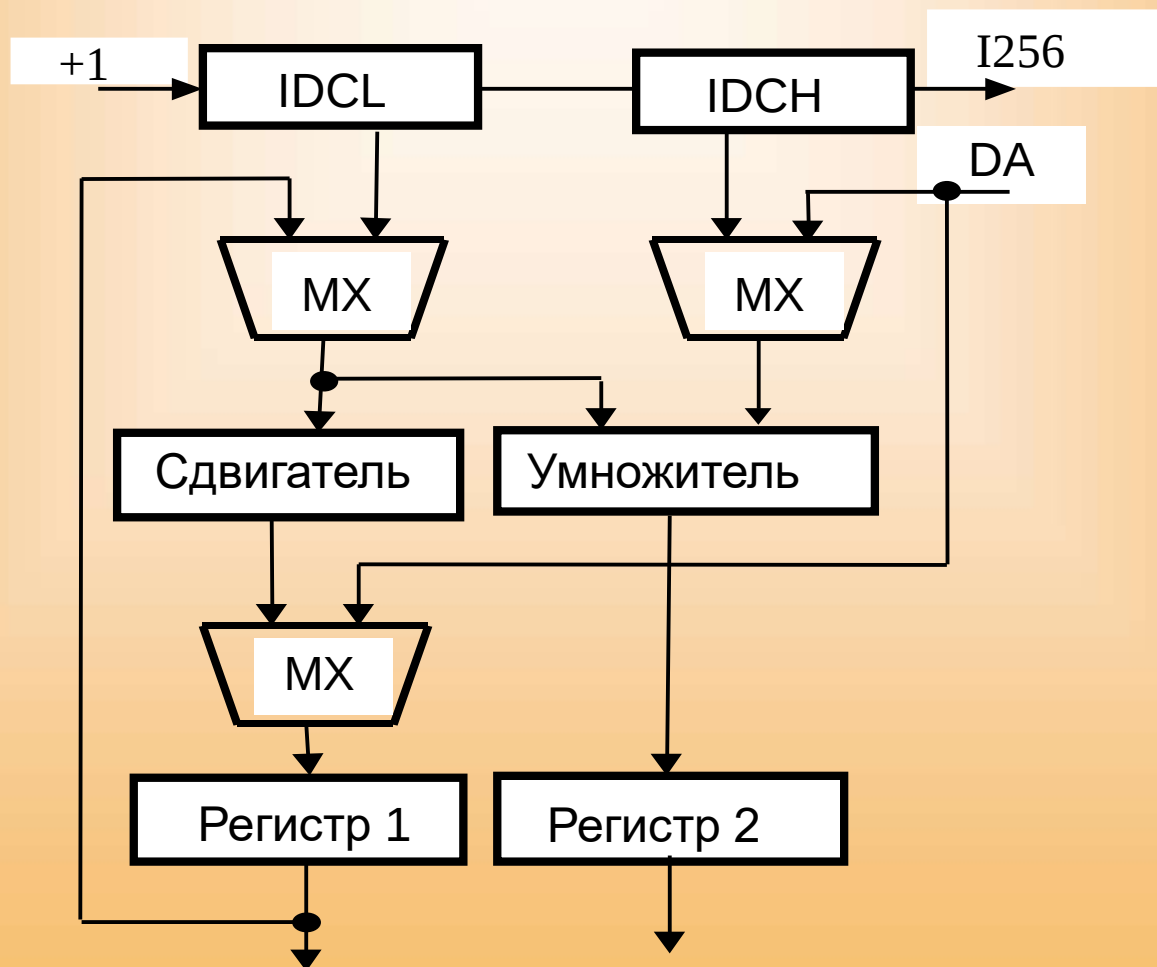


Постановка задачи:

- **Отбраковка опытных образцов на заводе-изготовителе**
- **Тестирование и отладка в условиях лаборатории**
- **Испытание опытных образцов**

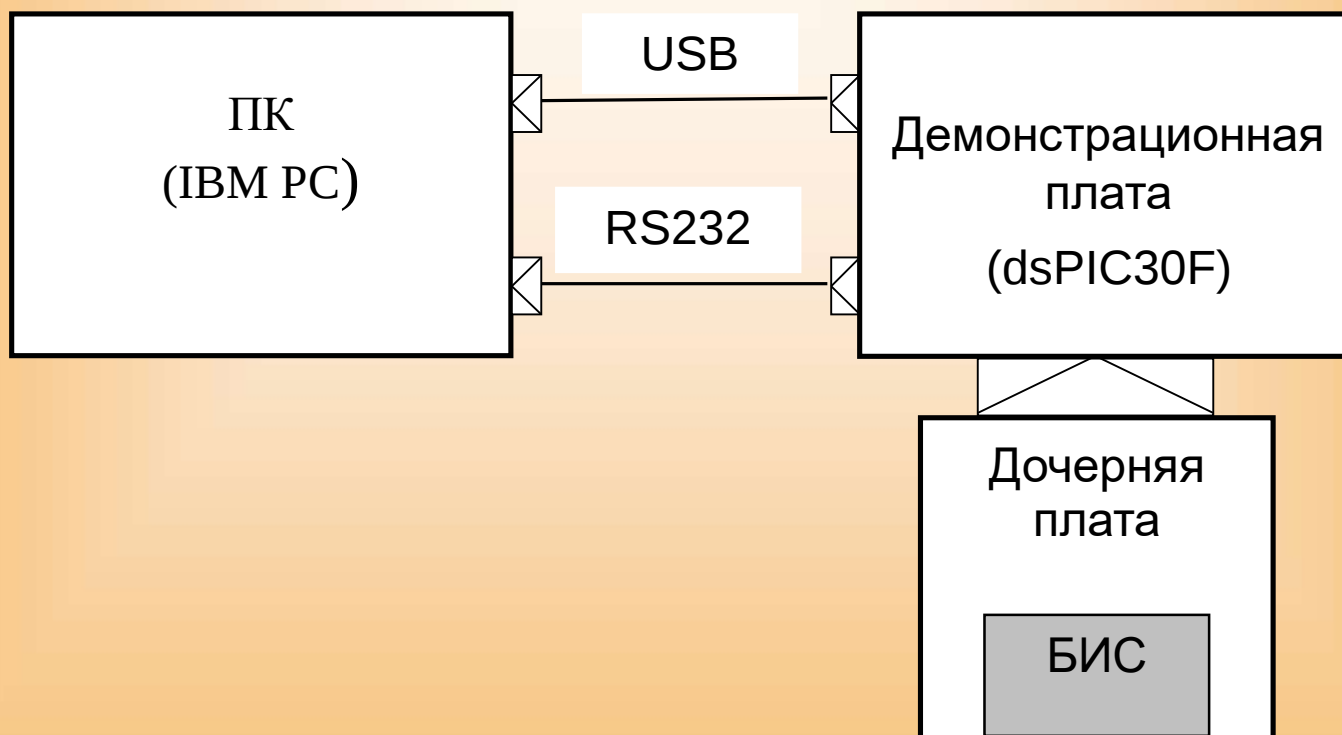


Структура вычислителя





Структура аппаратных средств



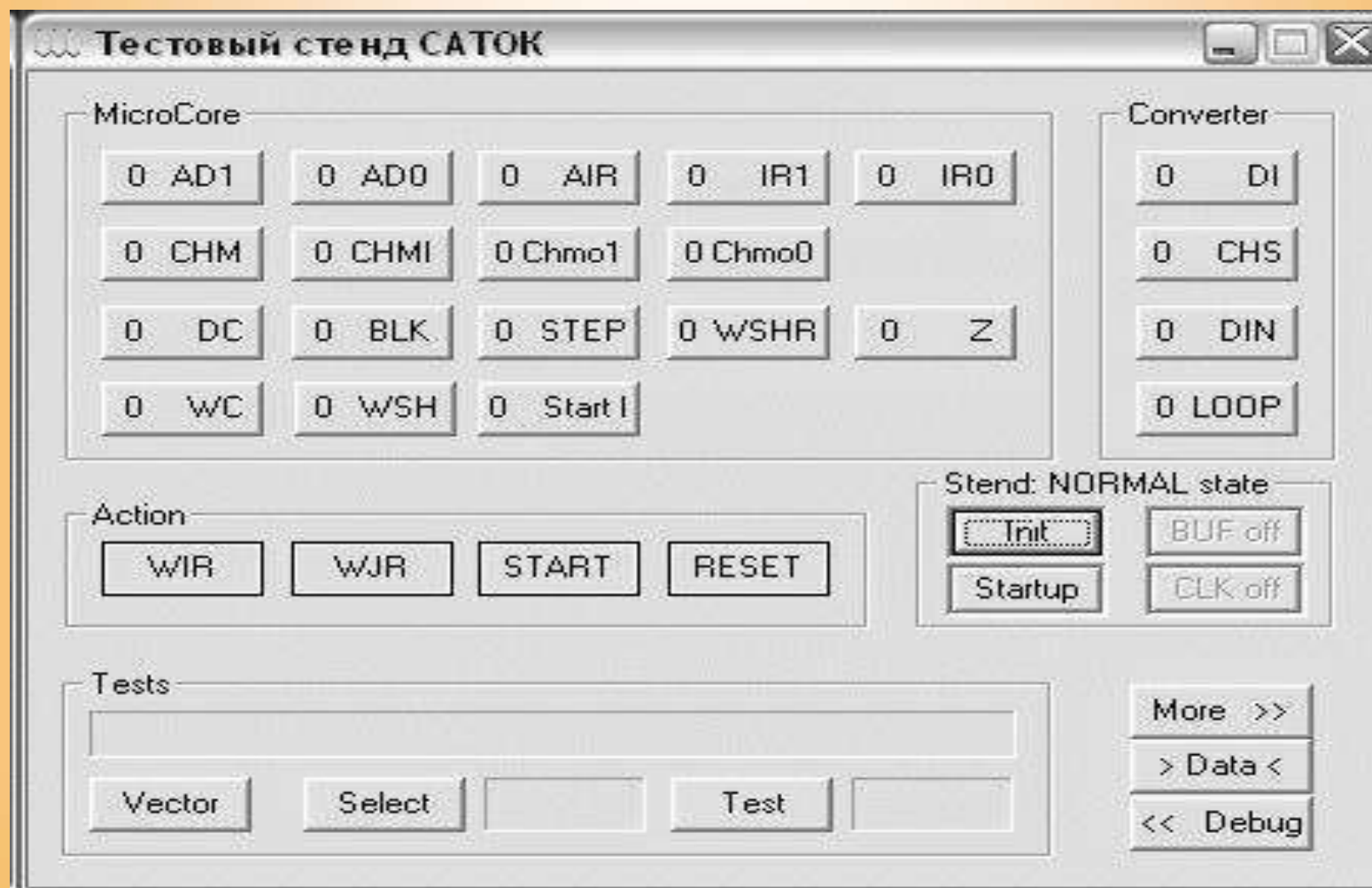


Состав программных средств

- Программа «Комплекс тестовый» (КТ)**
- Программа «Комплекс управления» (КУ)**



Главное окно программы KU





Заключение

- Разработанные и изготовленные средства тестирования самосинхронных микросхем САТОК позволили осуществить не только проверку опытных образцов микросхем в условиях лаборатории, но и провести сравнительные испытания синхронных и самосинхронных образцов микросхем.
- Для серийного производства самосинхронных микросхем необходимо разработать специальное контрольно-испытательное оборудование и более гибкие программные средства, которые можно будет настраивать на новые схемы.